

【公報種別】特許法第 17 条の 2 の規定による補正の掲載  
 【部門区分】第 7 部門第 1 区分  
 【発行日】令和 4 年 3 月 25 日(2022.3.25)

【公開番号】特開 2021-72212(P2021-72212A)  
 【公開日】令和 3 年 5 月 6 日(2021.5.6)  
 【年通号数】公開・登録公報 2021-021  
 【出願番号】特願 2019-198311(P2019-198311)  
 【国際特許分類】

H 0 1 R 3 3 / 7 6 ( 2 0 0 6 . 0 1 )

H 0 1 R 1 3 / 2 4 ( 2 0 0 6 . 0 1 )

G 0 1 R 3 1 / 2 6 ( 2 0 2 0 . 0 1 )

【 F I 】

H 0 1 R 3 3 / 7 6 Z

H 0 1 R 1 3 / 2 4

G 0 1 R 3 1 / 2 6 J

【手続補正書】

【提出日】令和 4 年 3 月 11 日(2022.3.11)

【手続補正 1】

【補正対象書類名】特許請求の範囲

【補正対象項目名】全文

【補正方法】変更

【補正の内容】

【特許請求の範囲】

【請求項 1】

コンタクトプローブアレイを有するピンブロックと、  
 検査対象の IC パッケージを前記コンタクトプローブアレイに案内する案内プレートと、  
 前記ピンブロックに係合する係合部を有し、当該係合部の係合によって前記案内プレートを抑えるカバーと、  
 を備え、  
 前記ピンブロックは、  
 前記案内プレートを着脱可能に支持する支持部と、  
 前記支持部によって支持された前記案内プレートの上を前記案内プレートの上面に沿って前記カバーがスライド移動することで前記係合部が係合する被係合部と、  
 を有する、  
 IC 検査用ソケット。

【請求項 2】

コンタクトプローブアレイを有するピンブロックと、  
 検査対象の IC パッケージを前記コンタクトプローブアレイに案内する案内プレートと、  
 前記ピンブロックに係合する係合部を有し、当該係合部の係合によって前記案内プレートを抑えるカバーと、  
 を備え、  
 前記ピンブロックは、  
 前記案内プレートを着脱可能に支持する支持部と、  
 前記支持部によって支持された前記案内プレートの上を、前記案内プレートを抑える方向と交差する方向に前記カバーがスライド移動することで前記係合部が係合する被係合部と、  
 を有する、  
 IC 検査用ソケット。

10

20

30

40

50

## 【請求項 3】

前記支持部は、前記カバーが前記案内プレートを抑える方向と反対の方向に前記案内プレートを弾性支持する、  
請求項 1 又は 2 に記載の IC 検査用ソケット。

## 【請求項 4】

前記カバーは、前記案内プレートの対向面に接する凹部を有し、  
前記凹部は、前記スライド移動の方向に沿って前記対向面に摺動可能なサイズである、  
請求項 1 ~ 3 の何れか一項に記載の IC 検査用ソケット。

## 【請求項 5】

前記被係合部は、頭部を有する軸体であり、  
前記カバーは、前記係合部に連続する位置に、前記軸体を挿通する挿通部を有し、  
前記係合部は、前記頭部の下面に係合する、  
請求項 1 ~ 4 の何れか一項に記載の IC 検査用ソケット。

10

## 【請求項 6】

前記軸体は、ネジであり、  
前記ピンブロックは、  
前記ネジに対応するネジ穴と、  
前記ネジ穴に挿入した前記ネジの頭部の下面に接触する突起部と、  
を有し、  
前記突起部の高さは、前記係合部の厚みより大きい、  
請求項 5 に記載の IC 検査用ソケット。

20

## 【請求項 7】

前記ピンブロックは、前記係合部が前記被係合部に係合した状態の前記カバーが前記スライド移動の方向に変位することを抑制する変位抑制部、を有する、  
請求項 1 ~ 6 の何れか一項に記載の IC 検査用ソケット。

## 【請求項 8】

コンタクトプローブアレイを有するピンブロックと、  
検査対象の IC パッケージを前記コンタクトプローブアレイに案内する案内プレートと、  
前記ピンブロックに係合する係合部を有し、当該係合部の係合によって前記案内プレートを抑えるカバーと、  
を備え、  
前記ピンブロックは、  
前記案内プレートを着脱可能に支持する支持部と、  
前記支持部によって支持された前記案内プレートの上を前記カバーがスライド移動することで前記係合部が係合する被係合部と、  
を有し、  
前記支持部は、前記カバーが前記案内プレートを抑える方向と反対の方向に前記案内プレートを弾性支持する、  
IC 検査用ソケット。

30

## 【請求項 9】

コンタクトプローブアレイを有するピンブロックと、  
検査対象の IC パッケージを前記コンタクトプローブアレイに案内する案内プレートと、  
前記ピンブロックに係合する係合部を有し、当該係合部の係合によって前記案内プレートを抑えるカバーと、  
を備え、  
前記ピンブロックは、  
前記案内プレートを着脱可能に支持する支持部と、  
前記支持部によって支持された前記案内プレートの上を前記カバーがスライド移動することで前記係合部が係合する被係合部と、  
を有し、

40

50

前記カバーは、前記案内プレートの対向面に接する凹部を有し、  
前記凹部は、前記スライド移動の方向に沿って前記対向面に摺動可能なサイズである、  
 IC検査用ソケット。

【請求項10】

コンタクトプローブアレイを有するピンブロックと、  
 検査対象のICパッケージを前記コンタクトプローブアレイに案内する案内プレートと、  
 前記ピンブロックに係合する係合部を有し、当該係合部の係合によって前記案内プレートを抑えるカバーと、

を備え、

前記ピンブロックは、

10

前記案内プレートを着脱可能に支持する支持部と、

前記支持部によって支持された前記案内プレートの上を前記カバーがスライド移動することで前記係合部が係合する被係合部と、

を有し、

前記被係合部は、頭部を有するネジであり、

前記カバーは、前記係合部に連続する位置に、前記ネジを挿通する挿通部を有し、

前記係合部は、前記頭部の下面に係合し、

前記ピンブロックは、

前記ネジに対応するネジ穴と、

前記ネジ穴に挿入した前記ネジの頭部の下面に接触する突起部と、

20

を有し、

前記突起部の高さは、前記係合部の厚みより大きい、

IC検査用ソケット。

【請求項11】

コンタクトプローブアレイを有するピンブロックと、

検査対象のICパッケージを前記コンタクトプローブアレイに案内する案内プレートと、  
 前記ピンブロックに係合する係合部を有し、当該係合部の係合によって前記案内プレートを抑えるカバーと、

を備え、

前記ピンブロックは、

30

前記案内プレートを着脱可能に支持する支持部と、

前記支持部によって支持された前記案内プレートの上を前記カバーがスライド移動することで前記係合部が係合する被係合部と、

前記係合部が前記被係合部に係合した状態の前記カバーが前記スライド移動の方向に変位することを抑制する変位抑制部と、

を有する、

IC検査用ソケット。

40

50